DIN EN 61300-3-35:2010-08 (D)

Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 3-35: Untersuchungen und Messungen - Visuelle und automatisierte Inspektion der Endflächen von Lichtwellenleiter-Steckverbindern (IEC 61300-3-35:2009); Deuts che Fassung EN 61300-3-35:2010

Inhalt

Seite

Vorwort 2
1 Anwendungsbereich 4
2 Normative Verweisungen 4
3 Messverfahren 4
3.1 Allgemeines 4
3.2 Messbedingungen 5
3.3 Vorbehandlung 5
3.4 Erholung 5
4 Prüfvorrichtung 5
4.1 Methode A: unmittelbare Betrachtung durch ein optisches Mikroskop 5
4.2 Methode B: Videomikroskopie 5
4.3 Methode C: Videomikroskopie mit automatisierter softwaregestützter Auswertung 5
4.4 Anforderungen an die Kalibrierung der Systeme mit niedriger und hoher Auflösung 6
5 Verfahren 6
5.1 Messbereiche 6
5.2 Kalibrierverfahren 7
5.3 Prüfablauf 7
5.4 Visuelle Anforderungen 9
Anhang A (informativ) Beispiele von untersuchten Endflächen mit Defekten 11
Anhang B (normativ) Kalibrierartefakt und Verfahren zur Herstellung 17
B.1 Artefakt für ein hochauflösendes System 17
B.2 Artefakt für ein System mit niedriger Auflösung 19
Literaturhinweise 20

Bilder

Bild 1 – Prüfablaufplan 8

Tabellen

Tabelle 1 – Messungsbereiche für Einfaser-Steckverbinder 6
Tabelle 2 – Messungsbereiche für Mehrfaser-Rechtecksteckverbinder mit Stift 7
Tabelle 3 – Visuelle Anforderungen an Steckverbinder mit PC-Politur, Einmodenfaser, RL ≥ 45 dB 9
Tabelle 4 – Visuelle Anforderungen an Steckverbinder mit Schräg-Politur (APC), Einmodenfaser 9
Tabelle 5 – Visuelle Anforderungen an Steckverbinder mit PC-Politur, Einmodenfaser, RL ≥ 26 dB 10
Tabelle 6 – Visuelle Anforderungen an Steckverbinder mit PC-Politur, Mehrmodenfaser, ... 10